

Фамилия, имя, отчество	Забелина Евгения Викторовна
Должность, ученая степень, ученое звание	Доцент, к.ф.-м.н.
Корпоративная электронная почта	zabelina.ev@misis.ru
Рабочий телефон	8-495-638-45-60
Область научных интересов	<p>Физика оксидных кристаллов: дефекты в кристаллах, оптические свойства кристаллов, электрофизические свойства кристаллов, спектрофотометрия, оптическая микроскопия, кристаллофизика, кристаллография</p> <p>Метрологическое обеспечение измерений: обеспечение системы менеджмента качества аккредитованных испытательных лабораторий, обеспечение качества измерений, разработка Методик выполнения измерений и Стандартных образцов</p>
Трудовая деятельность – год, организация, должность	<p>НИТУ МИСИС</p> <ul style="list-style-type: none"> - кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков с 2007 по наст. время: ассистент, доцент - аккредитованная испытательная лаборатория «Монокристаллы и заготовки на их основе» (аттестат аккредитации № ААС.А.00038, орган по аккредитации ААЦ «Аналитика») с 2004 г. по наст. время: инженер, ведущий инженер, зав. лабораторией - лаборатория Физики оксидных сегнетоэлектриков 2020 – 2023 научный сотрудник - кафедра физики кристаллов 2006 – 2007: ассистент
Образование Дополнительное образование	<p>НИТУ МИСИС, факультет полупроводниковых материалов и приборов, кафедра физики кристаллов</p> <p>2002 - бакалавр физики по направлению «Техническая физика»,</p> <p>2004 - магистр физики по направлению «Техническая физика»</p>
Основные результаты деятельности (перечисление достигнутых результатов)	<p>Исследование фундаментальных характеристик и установление механизмов дефектообразования, влияния дефектов на оптические, люминесцентные, сцинтилляционные и электрофизические параметры функциональных кристаллов сложных оксидов - кристаллы семейства лангасита, новых гадолиний-алюминий-галлиевых гранатов, молибдата кальция, сегнетоэлектрические кристаллы (триглицин сульфат, сегнетова соль, ниобат и танталат лития)</p> <p>Исследование пленочных структур.</p> <p>Разработка Методик выполнения измерений оптических параметров кристаллов</p>

<p>Значимые исследовательские/преподавательские проекты, гранты (тема, заказчик, год, полученные результаты)</p>	<p>Руководитель Госзадание FSME-0003-2023 (2023 – наст. время)</p> <p>Ответственный исполнитель Хоздоговора с АО «Фомос-Материалы» (2019), ООО «Лассард» (2020)</p> <p>Исполнитель</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФЦП № 154-6-334 от 24.10 2008 г. (2008-2010), № 2015/113 (2007-2012) - Госзадания ВУЗам № 0718-2020-0031 (2020-2023), № 11.5583.2017/7.8 (2017-2019), № 2015/113 (2014-2016) - РФФИ (2020, 2019-2021, 2016), - гранты КЗ НИТУ МИСИС (2015-2019) У.М.Н.И.К. (2009-2011) - Хоздоговор АО «Фомос-Материалы» (2004, 2002-2003) - Программа Минобразования (2001-2005) - Грант Министерства образования РФ (2002) - ЕЗН (2000-2004)
<p>Значимые публикации (список, не более 10)</p>	<p>1) D. Spassky, A. Spassky, V. Lebedev, F. Fedyunin, N. Kozlova, E. Zabelina, V. Kasimova, O. Buzanov Tolerance to the proton irradiation of the $Gd_3Al_xGa_{5-x}O_{12}$ ($x = 0,1,2,3$) scintillation crystals for future collider experiments // Optical Materials, 2023, 145(8):114477 https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114477</p> <p>2) Забелина Е.В., Козлова Н.С., Бузанов О.А. Оптические свойства кристаллов семейства лангасита: $La_3Ga_5SiO_{14}$, $La_3Ga_{5.5}Ta_{0.5}O_{14}$, $Ca_3TaGa_3Si_2O_{14}$ // Оптика и спектроскопия. 2023. Т. 131. № 5. С. 634-641. https://doi.org/10.21883/OS.2023.05.55715.67-22</p> <p>3) Забелина Е.В., Козлова Н.С., Бузанов О.А., Крупнова Е.Д. Влияние послеростовых отжигов в кислородсодержащей атмосфере на микротвердость монокристаллического молибдата кальция $CaMoO_4$ // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2023. Т. 26. № 1. С. 66-75. https://doi.org/10.17073/1609-3577-2023-1-66-75</p> <p>4) Козлова Н.С., Забелина Е.В. Кристаллические материалы для электронной промышленности и качество их измерений. Часть 1 // Контроль качества продукции. 2023. № 1. С. 16-21.</p> <p>5) Козлова Н.С., Забелина Е.В. Кристаллические материалы для электронной промышленности и качество их измерений. Опыт испытательной лаборатории // Контроль качества продукции. 2023. № 2. С. 47-50.</p> <p>6) V. M. Kasimova, N. S. Kozlova, O. A. Buzanov, E. V. Zabelina, A. V. Targonskii, and A. V. Rogachev Effect of Partial Substitution of Aluminium for Gallium on the</p>

	<p>Properties of Gadolinium Aluminum Gallium Garnet Single Crystals // Inorganic Materials. – 2022. - Vol. 58. - No. 3. - pp. 288–294. https://doi.org/10.1134/S0020168522030062</p> <p>7) Zabelina E.V., Kozlova N.S., Goreeva Z.A., Kasimova V.M. Multiangle Spectrophotometric Methods of Reflection for Determining Refractive Coefficients // Russian Microelectronics, 2020, 49(8), p. 617–625 http://doi.org/10.1134/S1063739720080120</p> <p>8) Kozlova N., Buzanov O., Zabelina E., Kozlova A., Voronova M., Shcherbachev K., Skryleva E. Study of the origin of the defects in La₃Ta_{0,5}Ga_{5,5}O₁₄ single crystals // Optical Materials. – 2019. – Vol. 91. – p. 482-487 https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.08.023</p> <p>9) Kozlova N.S., Zabelina E.V., Bykova M.B., Kozlova A.P. Features of the manifestation of surface electrochemical processes in ferroelectric crystals with low-temperature phase transitions // Russian Microelectronics.- 2019.- Vol. 48. - No. 8. -p. 146-155. https://doi.org/10.1134/S1063739719080092</p> <p>10) Buzanov O.A., Zabelina E.V., Kozlova N.S., Sagalova T.B. Near-electrode processes in lanthanum-gallium tantalate crystals // Crystallography Reports. – 2008. - 53(5), с. 853-857 https://doi.org/10.1134/S1063774508050210</p>
<p>Индекс Хирша по Scopus Количество статей по Scopus SPIN-код РИНЦ ORCID ResearcherID Scopus AuthorID</p>	<p>8 45 8024-6262 184814 0000-0002-5844-5673 H-3399-2015 16231986400</p>
<p>Значимые патенты (список, не более 10)</p>	<p>1) 11-391-2023 ОИС Материалы оптические. Методика выполнения измерений коэффициента преломления методом Брюстера (Козлова Н.С., Забелина Е.В., Касимова В.М., Быкова М.Б.)</p> <p>2) 50-391-2016 ОИС Методика выполнения измерений коэффициента отражения и показателей преломления спектрофотометрическим методом (Козлова Н.С., Козлова А.П., Быкова М.Б., Диденко И.С., Забелина Е.В., Спасский Д.А.)</p> <p>3) 35-391-2015 ОИС Программа оценивания показателей прецизионности, правильности и точности методик выполнения измерений (МВИ) (Козлова Н.С.,</p>

	<p>Быкова М.Б., Диденко И.С., Козлова А.П., Гореева Ж.А., Забелина Е.В., Спасский Д.А.)</p> <p>4) 37-391-2014 ОИС Оптические материалы. Методика измерения оптического качества методом Малляра (Козлова Н.С., Быкова М.Б., Диденко И.С., Козлова А.П., Забелина Е.В., Черных А.Г.)</p> <p>5) 115-033-2005 ОИС Способ нанесения токопроводящих покрытий на подложку из кристаллов семейства лангасита (Козлова Н.С., Забелина Е.В., Бузанов О.А., Сахаров С.П., Диденко И.С.)</p> <p>6) 114-003-2005 ОИС Способ повышения удельного электрического сопротивления кристаллов семейства лангасита в диапазоне температур до 450 °С, (Козлова Н.С., Забелина Е.В., Бузанов О.А., Сахаров С.П., Диденко И.С.)</p>
<p>Научное руководство/Преподавание</p>	<p>Руководство научными работами студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры</p> <p>Учебные курсы, читаемые в университете для направлений подготовки магистров 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неразрушающие методы испытания кристаллов; - Оптические явления в кристаллах.